

脱落失效分析，电子元器件铜盐加速醋酸盐雾试验

产品名称	脱落失效分析，电子元器件铜盐加速醋酸盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

脱落失效分析，电子元器件铜盐加速醋酸盐雾试验

晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化，动态范围变小。温度与允许功耗的关系如下：

公式中： P_{cm} ：大允许功耗 T_a ：使用环境温度 T_j ：晶体管的结温度 R_{ja} ：结与环境之间的热阻由上式可以看出，温度的升高将使晶体管的大允许功耗下降。+ 温度变化对电阻的影响对于电阻温度变化的影响主要是在温度升高的时候。温度升高会引起电阻热噪声增加、阻值偏离标称值、允许耗散概率下降等现象。打比方说，RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100 时，允许的耗散概率仅为标称值的20%。电阻的这一特性并不是只有坏处。比如，经过特殊设计的电阻：PTC（正温度系数热敏电阻）和NTC（负温度系数热敏电阻），它们的阻值受温度的影响很大，可以作为传感器。对于PTC，当其温度升高到某一阈值时，其电阻值会急剧增大。利用这一特性，可将其用在电路板的过流保护电路中——当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后，PTC的温度急剧升高，同时，其电阻值变大，限制通过它的电流，达到对电路的保护。而故障排除后，通过它的电流减小，PTC的温度恢复正常，同时其电阻值也恢复到其正常值。对于NTC，它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。